

宋跃 湖南邵阳 湖南邵阳师专物理系

摘要：本文论述了用MCS-51系列单片微机控制的数字集成电路,ADC器件、DAC器件、集成运放的测试原理。介绍了硬件结构整体设计和软件流程设计,研制成功的样机与其它同功能的测试系统相比,具有体积小、重量轻、扩展容易、测试范围宽、成本很低、操作方便和可靠性高等优点。是一种性能/价格比高的便携式测试仪。

关键词：

文章全文为PDF格式，请下载 to 本机浏览。[\[下载全文\]](#)

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [\[下载阅读器\]](#)

---

Abstract:

Key words:

[【大 中 小】](#) [\[关闭窗口\]](#)